先進的な
小角X線散乱装置

ナノスケールオーダーの構造評価に最適

小角 X 線散乱装置　Xeuss Pro/Nano-inXider

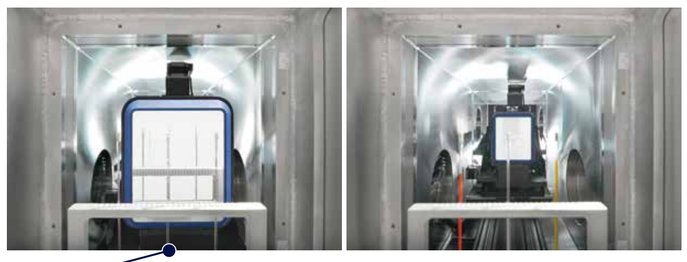
高い柔軟性を備えた多機能測定システム

複数線源（自動切換え）

電動化された USAXS アタッチメント（Bonse-Hart）

電動化された WAXS システム

Q-Xoom（電動化 3 軸ステージ）

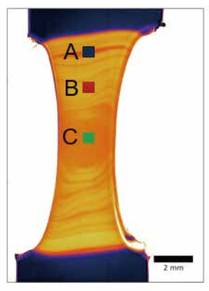


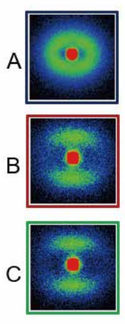
InXight X-ray イメージング module
AuX 線源 WAXS 用光学系

広い試料チャンバー

豊富な試料ステージ

真空にできる広い試料チャンバーと豊富な試料ステージにより様々な試料環境下での測定に対応





イメージング画像により異物や密度が異なる位置を特定して、SAXS/WAXS を測定することが可能

スマートな小角 X 線散乱装置　Nano-inXider

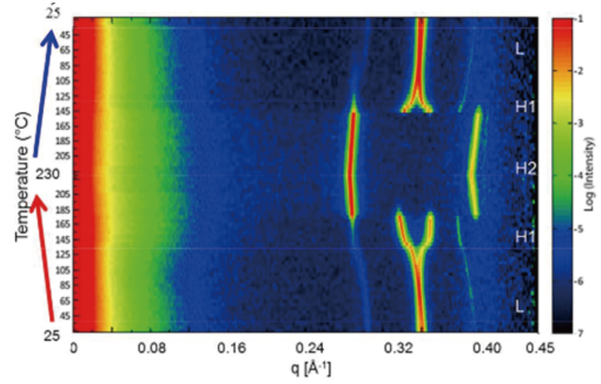
固定された SAXS と WAXS 検出器による同時測定

熱処理中の分子の配置変化を in situ SAXS/WAXS にて解析

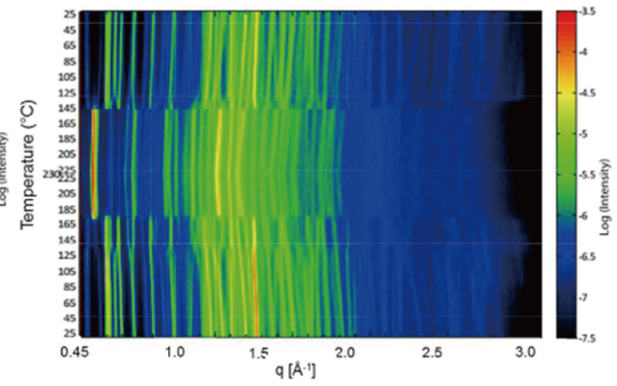
- di(HTh2BT)DTCTT (R = R2) with complex kinetical facto
- 10°C/min-5°Cstep, 10 min X-ray exposure

Sample courtesy of Lim Ming Pin, NTU, Singapore - Y. Abe et al., Chem. Mater., 2017, 29 (18), pp 7686–7696

- SAXS と WAXS の 2 つの固定検出器による同時測定
- SAXS の最小測定範囲は Q min < 0.029 nm^{-1}
  WAXS は最大 2θ < 60°まで測定可能
- 試料 - 検出器間の距離調整不要



SAXS: Gradual continuous phase transition from L to H1
Abrupt transition for H1 to H2



WAXS: Change in packing mode

Rigaku
POWERING NEW PERSPECTIVES

xenocs
Exploring the very small